

2008年4月17日

「Electronic Journal 第178回 Technical Seminar」講演のお知らせ

このたび、株式会社電子ジャーナルが開催します「LSI テスティング技術★徹底解説」にて「DRAM のテスト技術の現状と課題」と題したセミナー講演を行います。

記

講演日時 : 2008年4月24日(木) 10:50~11:50
テーマ : DRAM のテスト技術の現状と課題
講演者 : 取締役 兼 執行役員 CTO 小澤 雅英

【LSI テスティング技術★徹底解説 概要】

主催 : 電子ジャーナル
日時 : 2008年4月24日(木) 9:50~16:50
会場 : 総評会館(東京・御茶ノ水)
参加費 : 47,500円(テキスト・昼食代・消費税含む)
定員 : 50名

以上